特 許 協 力 条 約

PCT

REC'D 2 1 APR 2005

WIPO	PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 MDSW0030295P	今後の手続きについては、	様式PCT/IPEA/41	6を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/002585	国際出願日 (日.月.年) 02.03.2004	優先日 (日.月.年)	23. 05. 2003	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. 7	G11B7/24, 7/	2 6		
出願人(氏名又は名称) 松下電器産業株式会社				
1. この報告書は、PCT35条に基づ法施行規則第57条 (PCT36条) 2. この国際予備審査報告は、この表紙 3. この報告には次の附属物件も添付され	の規定に従い送付する。 を含めて全部で3 れている。	ページからなる。 国際予備審査機関が認めた訂] 明第607号参照) る国際出願の開示の範囲を超	Eを含む明細書、請求の範 えた補正を含むものとこの 媒体の種類、数を示す)。	
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 第 1 棚 国際予備審査報告の基礎 第 I 棚 優先権 第 II 棚				
			,	
国際予備審査の請求掛を受理した日 06.07.2004	国際	予備審査報告を作成した日29.03.3	2005	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JI 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4	?) 5	F庁審査官(権限のある職員) 橘 均嶽	5D 3045	

第I棡	報告の基礎
1. 20	国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の曾語を基礎とした。
	この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 これは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 PCT規則12. 3及び23. 1 (b) にいう国際調査 PCT規則12. 4にいう国際公開 PCT規則55. 2又は55. 3にいう国際予備審査
	報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され 用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
	出願時の国際出願書類
. 🗙	明細 <mark>き</mark> 1-19
×	請求の範囲 項、 出願時に提出されたもの 第 7-10 項、 出願時に提出されたもの 第 1,4-6,11 項*、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの 項*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第
	図面 第 <u>1/3-3/3</u> ページ /図 、 出願時に提出されたもの 第 <u>イージ/図*、</u> 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 <u>ページ/図*、</u> 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。
3. ×	補正により、下記の書類が削除された。
	明細書 第
4.	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))
	財細書 第 ページ 請求の範囲 第 項 図面 第 ページ/図 配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
* 4.	に該当する場合、その用紙に"superseded"と記入されることがある。

	初时江门内,	D			
第1	7柳 新規性、進歩性又は産業」 それを <u>築付ける文献及び</u> 割	上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、 ^{説明}			
1.	見解	·			
	新規性(N)	請求の範囲 1,4-11 有 請求の範囲 無			
	進歩性(IS)	請求の範囲			
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 1,4-11 有 請求の範囲 無			
2.	2. 文献及び説明(PCT規則70.7)				
	2003.00 2003.00 21P2003.00 21P2002.00 21P202.00 21P202.00 21P202.00 21P202.00 21P202.00 21P202.00 21P202.00 22P22.00 22P22.00	3-59130 A (ソニー株式会社) 2.28 【発明の実施の形態】 (ファミリーなし) 3-59105 A (ソニー株式会社) 2.28 【発明の実施の形態】 (ファミリーなし) 2-230840 A ンスティチュート オブ サイエンス アンド テクノロージ) 8.16,全文、全図 (ファミリーなし) 44320 A (株式会社リコー) 5.28,全文、全図 (ファミリーなし) 769 A (日本電気株式会社) 1.08,全文、全図 (ファミリーなし) 66742 A (日本電気株式会社) 2.10,全文、全図 (ファミリーなし) 1.31250 A (株式会社日立製作所) 6.18,全文 (ファミリーなし) 338 A (旭化成工業株式会社) 1.08,全文 (ファミリーなし) 該38 A (旭化成工業株式会社)			
		·			

20

請求の範囲

1. (補正後)

レーザ光を用いて情報の再生が可能な光学的情報記録媒体において、

5 基板の上に、少なくとも反射層、記録層をこの順に有し、

前記反射層は1原子%以上5原子%以下のNiを含むAi合金であることを特 数とする光学的情報記録媒体。

- 2. (削除)
- 3. (削除)
- 10 4. (補正後)

前記反射層は前記基板上に成膜されて形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の光学的情報記録媒体。

5. (補正後)

前記反射層の膜厚は、20nm以上300nm以下であることを特徴とする請 15 求項1または4に記載の光学的情報記録媒体。

6. (補正後)

カバー層と、前配反射層と前配配録層との間に配置された反射層側誘電体層と、前配配録層と前配カバー層との間に配置された光入射側誘電体層とをさらに有していることを特徴とする請求項1、4、5のいずれかに記載の光学的情報記録媒20 体。

7.

前配反射側誘電体層は、Sを含有していることを特徴とする請求項6に記載の 光学的情報記録媒体。

8.

25 前記反射層側誘電体層の主成分が Zn Sまたは酸化物、前配記録層の主成分が GeとSbとTeもしくはGeとBiとTe、前記光入射側誘電体層の主成分が Zn Sまたは酸化物であることを特徴とする請求項6または7記載の光学的情報 記録媒体。

9.

前記反射層側誘電体層の膜厚が15nm以上50nm以下、前記記録層の膜厚が5nm以上15nm以下、前記光入射側誘電体層の膜厚が10nm以上100nm以下であることを特徴とする請求項6から8のいずれかに記載の光学的情報記錄媒体。

5 10.

前記反射側誘電体層は前記反射層に接していることを特徴とする、請求項6から9のいずれかに記載の光学的情報記録媒体。

11. (補正後)

基板の上に、少なくとも反射層、配録層をこの順に作製する工程を含む光学的 10 情報記録媒体の製造方法であって、

前記反射層を成膜する工程が、1原子%以上5原子%以下のNiを含むAl合金からなるスパッタリングターゲットを用いることを特徴とする光学的情報記録 媒体の製造方法。

12. (削除)

15 13. (削除)